# Возбуждение люминесценции автолокализованных экситонов при рекомбинации френкелевских дефектов в ВеО

© С.В. Горбунов, В.Ю. Яковлев\*

Уральский государственный технический университет, 620002 Екатеринбург, Россия \* Томский политехнический университет, 634034 Томск, Россия

E-mail: zats@dpt.ustu.ru

(Поступила в Редакцию 14 апреля 2004 г. В окончательной редакции 6 августа 2004 г.)

Представлены данные по изучению поляризованной люминесценции и короткоживущего оптического поглощения (КОП), наводимых в кристаллах оксида бериллия при импульсном электронном облучении. Экспоненциальные стадии с временем затухания  $\tau = 6.5$  ms обнаружены в полосах люминесценции при 4.0, 5.0 и 6.7 eV, совпадающих по спектральным и поляризационным свойствам с люминесценцией автолокализованных экситонов (АЛЭ) двух типов. Эффективность образования центров с временем распада 6.5 ms сопоставима с эффективностью образования триплетных АЛЭ. Характер кинетики и времен затухания КОП данных центров не зависит от флюенса электронов и обусловлен мономолекулярным процессом рекомбинации. Установлено, что спектры центров КОП с временем затухания 6.5 ms подобны спектрам дырочных центров V-типа и дырочных компонент АЛЭ. Обсуждается механизм процессов, в соответствии с которым рекомбинация близких пространственно-коррелированных френкелевских пар, Be<sup>+</sup>- и V<sup>-</sup>-центров проявляется в виде экспоненциального компонента с временем затухания 6.5 ms в люминесценции АЛЭ двух типов в BeO.

### 1. Введение

Существование в оксиде бериллия двух различных типов автолокализованных экситонов (АЛЭ) было обнаружено ранее с использованием люминесцентных методов исследования [1,2]. Проявление двух типов АЛЭ обусловлено наличием двух видов связей в вюрцитной решетке ВеО:  $Be-O_{axial}$  и  $Be-O_{non-axial}$ , направленных параллельно и под углом  $109^{\circ}$  относительно оптической оси *С* кристалла соответственно. Параметры люминесценции, времен затухания и поляризации позволили авторам [1,2] связать полосы при 6.7 и 4.0 eV с триплетными и синглетными "аксиальными" АЛЭ (в дальнейшем АЛЭ I). Свечение при 4.9 eV было отнесено к триплетным "неаксиальным" АЛЭ (в дальнейшем АЛЭ II).

Структура обоих типов триплетных АЛЭ в ВеО была изучена в дальнейшем с помощью метода импульсной абсорбционной спектроскопии с временным разрешением при возбуждении электронными пучками наносекундной длительности [1,3]. В спектре короткоживущего оптического поглощения (КОП) АЛЭ I и АЛЭ II была обнаружена полоса при 1.7 eV, связанная с оптическими переходами в электронном компоненте экситона. По данным [3] было сделано заключение, что электронные компоненты обоих типов триплетных АЛЭ имеют одинаковую структуру. Как показали недавние исследования АЛЭ в ВеО методом оптически детектируемого магнитного резонанса [4], электронный компонент АЛЭ частично локализован на *s*-состояниях бериллия. В области спектра КОП АЛЭ при  $E > 2 \, \text{eV}$  были обнаружены переходы в дырочном ядре, структура которого для АЛЭ I и АЛЭ II различна. В кинетике затухания КОП в области дырочного компонента АЛЭ I кроме стадии, обусловленной временем жизни АЛЭ I, наблюдалась экспоненциальная стадия с временем релаксации  $\tau = 6.5$  ms. По данным [5], этот компонент связывался с образованием и распадом автолокализованных дырок. Тот же экспоненциальный компонент с  $\tau = 6.5$  ms был обнаружен в кинетике затухания люминесценции в области 4.0 eV [6]. Он был интерпретирован как излучательные переходы из расщепленного в кристаллическом поле низкой симметрии триплетного состояния АЛЭ II. Таким образом, полученные в [5,6] противоречивые данные о центрах, связанных с компонентом 6.5 ms, не позволили достаточно точно установить их природу.

В настоящей работе проведен поиск компонента кинетики затухания с  $\tau = 6.5$  ms в люминесценции АЛЭ. В результате анализа данных по люминесценции и КОП установлены закономерности возбуждения люминесценции двух типов АЛЭ, связанные с образованием и рекомбинацией близких, пространственно-коррелированных катионных френкелевских пар дефектов ВеО.

#### 2. Экспериментальная техника

Исследования выполнены на номинально чистых кристаллах ВеО, выращенных методом Чохральского-Киропулоса из раствора оксида бериллия в расплаве вольфрамата натрия [7]. Уровень характерных примесей Li, B, Mg, Al, Zn не превышал 10 ppm. Оптические измерения в спектральной области 1.0–6.0 eV проведены при температурах 80–300 K на установке импульсной абсорбционной и люминесцентной спектроскопии с наносекундным временным разрешением [8]. Для возбуждения использовался импульсный ускоритель электронов ГИН-600 с параметрами пучка:  $E_e = 0.25$  MeV, W = 0.02 - 0.5 J/cm<sup>2</sup>,  $t_{pulse} = 10^{-8}$  s. Дополнительные исследования спектров оптического поглощения в поляризованном свете и поляризованной люминесценции выполнены с помощью призмы Рошона. Степень поляризации люминесценции определялась как

$$P = (I_{\parallel} - I_{\perp})/(I_{\parallel} + I_{\perp}),$$

где  $I_{\parallel}$  и  $I_{\perp}$  — интенсивность люминесценции параллельно и перпендикулярно оптической оси *C* кристалла BeO соответственно.

## 3. Экспериментальные результаты и обсуждение

В кинетике затухания люминесценции в области 3.0-6.0 eV наряду с компонентами, обусловленными излучательной релаксацией двух типов АЛЭ (см. таблицу), обнаружена экспоненциальная стадия с временем затухания  $\tau = 6.5$  ms. На рис. 1 представлен наведенный импульсом электронов при 80 К спектр катодолюминесценции (КЛ) ВеО, измеренный с временной задержкой  $t_d = 15 \, {\rm ms}$  для исключения влияния на несколько порядков более интенсивной люминесценции АЛЭ. Как видно из результата разложения на гауссовы составляющие, спектр КЛ компонента с  $\tau = 6.5 \, \text{ms}$  состоит из трех полос. Полоса при 4.0 eV, имеющая степень поляризации  $P = +0.64 \pm 0.03$ , совпадает по спектральным и поляризационным параметрам с люминесценцией синглетных АЛЭ I (см. таблицу). В области спектра при  $E > 5.5 \, \text{eV}$ наблюдается резкий рост интенсивности люминесценции. Как видно из рис. 1, спектральное поведение в этом диапазоне "инерционной" стадии люминесценции хорошо согласуется со спектральной зависимостью длинноволнового спада полосы 6.7 eV триплетных АЛЭ I. При этом степень поляризации свечения с временем релаксации 6.5 ms при 6.0 eV, равная  $-0.70 \pm 0.05$ , практически идентична таковой для люминесценции триплетных АЛЭ I (см. таблицу). Следует отметить, что интенсивность люминесценции медленного компонента, при гауссовой аппроксимации в область максимума полосы 6.7 eV на два порядка превышает интенсивность люминесценции при 4.0 eV.

Спектрально-кинетические и поляризационные свойства люминесценции АЛЭ в ВеО

Тип АЛЭ	Максимум	Время	Степень
	люминесценции	затухания	поляризации
	<i>E<sub>m</sub></i> , eV	<i>т</i> , s	Р
Синглетный АЛЭ I Триплетный АЛЭ I Триплетный АЛЭ II	4.0 6.7 4.9	$\begin{array}{c} 2 \cdot 10^{-9} \\ 340 \cdot 10^{-6} \\ 36 \cdot 10^{-6} \end{array}$	$+0.67 \\ -0.75 \\ -0.60$



**Рис. 1.** Спектр люминесценции, измеренный при 80 К с задержкой 15 ms после окончания импульса электронного облучения.

Кроме полос люминесценции при 4.0 и 6.7 eV, отнесенных к синглетным и триплетным АЛЭ I, в спектре КЛ компонента с  $\tau = 6.5$  ms наблюдается полоса с максимумом при 5.0 eV. Степень поляризации в области около 4.7 eV оказалась равной  $P = -0.30 \pm 0.10$ . Эта величина немного отличается от степени поляризации люминесценции триплетных АЛЭ II (см. таблицу) изза вклада в этой области положительно поляризованной люминесценции при 4.0 eV. Спектральные и поляризационные характеристики полосы люминесценции при 5.0 eV с временем затухания 6.5 ms позволяют предположить связь этой полосы с люминесценцией триплетных АЛЭ II.

Подтверждением приведенных выше выводов являются полученные температурные зависимости времен релаксации и начальной интенсивности полос люминесценции компонента с  $\tau = 6.5 \,\mathrm{ms}$  (рис. 2). Как видно, закономерности поведения данных зависимостей совпадают: при T > 100 К наблюдается укорочение времен затухания и одновременное увеличение начальной интенсивности с одинаковой энергией активации  $E_a = 120 \pm 10$  meV. Данное температурное поведение предполагает, что вклад компонента с  $\tau = 6.5 \,\mathrm{ms}$  в светосумму, высвечиваемую в полосах люминесценции при 4.0, 5.0 и 6.7 eV, является величиной постоянной. Таким образом, в люминесцентных исследованиях кристаллов ВеО обнаружены центры, процесс разрушения которых с постоянной времени 6.5 ms приводит к образованию люминесцентных состояний обоих типов АЛЭ.

Для изучения природы этих центров проведено детальное исследование кинетики затухания и спектров КОП, наведенного импульсом электронов при 80 К. В области 3.6 eV процесс затухания оптического по-



**Рис. 2.** Температурные зависимости времен затухания люминесценции (1, 3), КОП (2) и начальной интенсивности люминесценции (4, 5) в области при 4.0 eV (1, 5) и при 6.0 eV (3, 4).



**Рис. 3.** *а* — кинетика релаксации короткоживущего оптического поглощения при 3.6 eV, наведенного при 80 K в кристаллах BeO импульсом электронного пучка. Штриховые кривые — результаты разложения кинетики на экспоненциальные функции. *b* — зависимости амплитудных значений оптической плотности компонент кинетики затухания оптического поглощения от флюенса электронов.

глощения может быть описан суммой трех экспоненциальных компонент с временами затухания  $\tau_1 = 340 \,\mu$ s,  $\tau_2 = 6.5 \,\mathrm{ms}$ ,  $\tau_3 = 450 \,\mathrm{ms}$  (рис. 3). Это свидетельствует о наличии трех различных центров неустойчивого поглощения, первым из которых с временем затухания  $340 \,\mu$ s излучательно релаксирует триплетный АЛЭ I. Изучение температурных зависимостей времен затухания и начальной оптической плотности компонента с  $\tau_2 = 6.5 \,\mathrm{ms}$ показало, что время разрушения ответственных за этот компонент центров укорачивается при  $T > 100 \,\mathrm{K}$  с той же энергией активации  $E_a = 120 \pm 10 \,\mathrm{meV}$ , с которой убыстряются релаксационные процессы в компоненте с  $\tau_2 = 6.5 \,\mathrm{ms}$  люминесценции АЛЭ I и АЛЭ II (рис. 2). При этом начальная амплитуда оптического поглощения данных центров не зависит от температуры. Оцененная по величине начальной оптической плотности поглощения эффективность создания центров, ответственных за компонент с  $\tau_2 = 6.5 \,\mathrm{ms}$ , оказалась сравнимой (70-80% от начальной оптической плотности компонента с  $\tau_1 = 340 \,\mu\mathrm{s}$ ) с эффективностью образования триплетных АЛЭ I.

Для подробного анализа релаксационных процессов были исследованы зависимости кинетики затухания и начальной оптической плотности КОП от флюенса электронного пучка. Полученные результаты позволили установить следующие особенности центров метастабильного оптического поглощения.

1) Изменение величины наводимой импульсами электронов оптической плотности поглощения АЛЭ I и центров с характерным временем распада 6.5 ms линейно растет при увеличении флюенса электронов (рис. 3). Этот факт указывает на собственную природу последних.

2) Изменение амплитудного значения оптической плотности поглощения центров с характерным временем разрушения 450 ms от флюенса электронов описывается насыщающейся зависимостью (рис. 3). Это свидетельствует о том, что данными центрами являются дефекты решетки или примеси.

3) Увеличение флюенса электронов не приводит к изменению экспоненциального вида кинетики и величины времени затухания компонента с  $\tau = 6.5$  ms. Данный факт кинетического поведения обусловлен мономолекулярным процессом рекомбинации в генетических парах [9]. Примером этого может служить рекомбинация, вызванная кулоновским или упругим взаимодействием заряженных или нейтральных дефектов. В частности, такие релаксационные процессы известны для пространственно-коррелированных анионных френкелевских пар в щелочно-галоидных кристаллах ( $\alpha$ –I и F-H центры) [10].

Особенностью гексагональной (вюрцитной) кристаллической решетки ВеО можно считать плотнейшую упаковку ионов кислорода, половина тетраэдрических пустот которой занята ионами бериллия, а другая половина тетраэдрических ( $r_t = 0.34 \,\text{\AA}$ ) и все октаэдрические ( $r_{oct} = 0.55 \text{ Å}$ ) пустоты образуют междоузельное пространство [11]. Сравнивая эффективные радиусы иона  $O^{2-}$  (1.36 Å) и иона  $Be^{2+}$  (0.34 Å), мы предположили, что в ВеО более вероятным может быть процесс образования "тесных" катионных френкелевских пар дефектов (КФПД). Для подтверждения данной гипотезы были изучены спектры КОП при 80К с различной временной задержкой относительно окончания импульса электронов (рис. 4). Сравнение спектров наведенного поглощения показывает, что для центров с временем релаксации 6.5 ms отсутствует полоса при 1.7 eV, обусловленная оптическими переходами в электронном компоненте АЛЭ. Поскольку электронный компонент представляет собой электрон, локализованный на s-состояниях бериллия [4], данный факт может быть связан со смещением иона Ве+ из узла кристаллической решетки в междоузельное пространство. Спектр



**Рис. 4.** Спектры КОП (1-3), измеренные в момент окончания электронного облучения (1) и с задержкой 5 ms (2, 3). Спектры стационарного оптического поглощения дырочных  $V_B$ -центров (4, 5). Для поляризованного света  $\mathbf{E} \perp \mathbf{C}$  (1, 3, 5) и  $\mathbf{E} \parallel \mathbf{C}$  (2, 4).

КОП при E > 2 eV центров с временем распада 6.5 ms находится в области оптических переходов в дырочном ядре АЛЭ в ВеО. Кроме того, спектр данных центров хорошо согласуется со спектром поглощения  $V^-$  и  $V_B$ стабильных дырочных центров, представляющих собой дырку, захваченную на ионах кислорода (центр O<sup>-</sup>) около изолированной катионной вакансии или около катионной вакансии, ассоциированной с ионом  $B^{2+}$ , выступающим зарядовым компенсатором (рис. 4).

На основе совокупности описанных результатов нами предложен следующий механизм образования центров, процессы рекомбинации которых сопровождаются люминесценцией обоих типов АЛЭ в BeO с временем затухания 6.5 ms.

1) На первом этапе под действием электронного пучка идут процессы образования и релаксации в автолокализованное состояние экситонов, сопровождаемые локализацией электрона на *s*-состояниях иона бериллия в виде Be<sup>+</sup>-центра и дырки на *p*-состояниях иона кислорода в виде O<sup>-</sup>-центра.

2) При быстрой колебательной релаксации электронной подсистемы АЛЭ в наинизшее люминесцентное состояние катион в виде иона Be<sup>+</sup> получает энергию, достаточную для его смещения в междоузельную позицию с образованием заряженных пространственно-коррелированных КФПД: Be<sup>+</sup>- и V<sup>-</sup>-центров.

3) Кулоновское взаимодействие стимулирует процесс рекомбинации "тесных" КФПД, происходящих с временем релаксации 6.5 ms при 80 К. Это приводит к восстановлению кристаллической решетки и образованию возбужденных состояний обоих типов АЛЭ в ВеО. Излучательная релаксация из этих состояний в полосах люминесценции синглетных и триплетных АЛЭ I при 4.0 и 6.7 eV, а также в полосе свечения при 5.0 eV триплетных АЛЭ II проявляется в виде экспоненциального компонента мономолекулярной кинетики затухания. При увеличении температуры наблюдается ускорение процессов рекомбинации близких КФПД с энергией активации 120 meV при постоянстве вклада этого механизма в светосумму люминесценции обоих типов АЛЭ в BeO.

Остается открытым вопрос о возможности пространственного разделения компонентов КФПД в ВеО. В кинетике наведенного электронным импульсом поглощения наблюдается стадия с временем затухания  $\tau_3 = 450 \,\mathrm{ms}$  (рис. 3). Приведенные выше характеристики ответственных за эту стадию центров позволяют связать их с дефектами. Мы предполагаем, что этими метастабильными дефектами могут являться пространственно-разделенные компоненты катионных френкелевских пар (Be<sup>+</sup>- и V<sup>-</sup>-центры), которые образуются при "диссоциации" пространственно-коррелированных КФПД. Действительно, спектр КОП стадии с временем затухания 450 ms подобен спектру поглощения стабильных дырочных центров окраски V-типа. Медленные времена релаксации этих центров обусловлены процессами локализации и миграции интерстициалов (ионов Be<sup>+</sup>), удаленных от V-центров на значительные расстояния. При  $T > 120 \,\mathrm{K}$  наблюдается термоактивированное ускорение данных процессов с энергией активации 190 ± 10 meV, приводящих к уменьшению времени затухания компонента с  $\tau = 450 \,\mathrm{ms}$  при рекомбинации пространственно-разделенных Be<sup>+</sup> V<sup>-</sup> френкелевских пар. Энергия активации (190 meV) термоактивированной рекомбинации пространственно-разделенных КФПД больше, чем энергия активации (120 meV) термоактивированной рекомбинации пространственно-коррелированных КФПД.

Энергия активации 190 meV близка к средней энергии активации ~ 200 meV в области пика термостимулированной люминесценции (ТСЛ) 100 К, присущего всем кристаллам BeO [12]. Найденный в [12] спектральный состав пика ТСЛ при 100 К, содержащий полосы при 4.9 и 6.7 eV люминесценции АЛЭ, может определяться рекомбинацией пространственно-разделенных компонентов КФПД.

Авторы благодарны А.Ф. Зацепину, С.О. Чолаху и А.И. Кухаренко за полезные дискуссии и помощь в работе.

#### Список литературы

- S.V. Gorbunov, S.V. Kudyakov, B.V. Shulgin, V.Yu. Yakovlev. Radiation Effects and Defects in Solids 135, 269 (1995).
- [2] В.А. Пустоваров, В.Ю. Иванов, М. Кирм, А.В. Кружалов, А.В. Коротаев, Г. Циммерер. ФТТ 43, 7, 1189 (2001).
- [3] С.В. Горбунов, С.В. Кудяков, В.Ю. Яковлев, А.В. Кружалов. ФТТ 38, 4, 1298 (1996).
- [4] U. Rogulis, S.V. Gorbunov, J.-M. Spaeth. Proc. of 12th Int. Conf. on Radiation Phys. and Chem. Inorg. Materials. Tomsk, Russia (2003). P. 38.

- [5] С.В. Горбунов, С.В. Кудяков, В.Ю. Яковлев, А.В. Кружалов. ФТТ 38, 1, 214 (1996).
- [6] S.V. Gorbunov, K.V. Bautin, A.V. Kruzhalov, V.Yu. Yakovlev. Abstracts of the 5-th Int. Conf. on Inorg. Scint. and Their Applic. SCINT99. M. (1999). P. 73.
- [7] Yu.V. Shurupov, A.V. Kruzhalov, S.V. Gorbunov. Int. Union of Crystallography. Bordeaux, France (1990). PS 13.03.22.
- [8] Б.П. Гриценко, В.Ю. Яковлев, Г.Д. Лях, Ю.Н. Сафонов. Тез. Всесоюз. конф. по метрологии быстропротекающих процессов. М. (1978). С. 61.
- [9] Ю.Р. Закис, Л.Н. Канторович, Е.А. Котомин, В.Н. Кузовков, И.А. Тале, А.Л. Шлюгер. Модели процессов в широкощелевых твердых телах с дефектами. Зинатне, Рига (1991). 382 с.
- [10] Ч.Б. Лущик, А.Ч. Лущик. Распад электронных возбуждений с образованием дефектов в твердых телах. Наука, М. (1989). 264 с.
- [11] Р.А. Беляев. Окись бериллия. Атомиздат, М. (1980). 224 с.
- [12] И.Н. Огородников, В.Ю. Иванов, А.В. Кружалов. ФТТ **36**, *11*, 3287 (1994).